基於 DSP 晶片的一維納米定位控制系統研製 Development of a one-dimensional nano-positioning control system based on DSP chip

李瑞君* 何园涛 王鹏宇 范光照 合肥工業大學儀器科學與光電工程學院 E-mail: rj-li@hfut.edu.cn

摘要

研製了一套以 DSP 晶片為主控制器的高精 度一維納米定位控制系統。該系統主要由驅動 平臺、微型邁克爾遜干涉儀、DSP 控制器等三 個模組組成。其中驅動平臺模組由線性滑軌、 超聲波馬達 HR4 和驅動器 AB2 組成。超聲波馬 達 HR4 和驅動器 AB2 組成。超聲波馬 動側面貼有陶瓷片的線性滑軌,微型邁克爾遜 干涉儀用來感測滑軌的位移值。基於 BP 神經網 路的 PID 控制演算法和邁克爾遜干涉儀的相位 計算全部由主控制器 DSP 晶片完成。實驗結果 表明,該定位系統行程為 20 mm,定位精度優 於 10 nm,重複定位標準差為 7 nm。該定位系 統具有系統架構簡單,定位精度高等優點,可 用于大行程高精度定位應用場合。

關鍵詞:納米定位;DSP;邁克爾遜干涉儀; 壓電陶瓷驅動;BP神經網路;

Abstract

high-precision one-dimensional А nano-positioning control system based on DSP controller is presented in this paper. The system is mainly composed of a driving platform, a miniature Michelson interferometer and a DSP controller. The driving platform module is made of a linear guide, a ultrasonic motor (HR4) and its driven (AB2). The HR4 and AB2 are used to move the ceramic wafer on the linear guide by the friction. The miniature Michelson interferometer is used to detect the platform's displacement. Both the PID control algorithm based on BP neural network and the phase calculations of the sensor are finished by the DSP controller. The experimental results show that the positioning accuracy of the nano-positioning system is better than 10 nm within 20 mm range, and the standard deviation is 7 nm. The positioning system has the advantages of simple structure, high positioning accuracy, and can be used on the occasion of high-precision positioning.

Keywords: nanopositioning; DSP; Michelson interferometer; Piezoelectric ceramics driver; BP neural network;

1. 前言

當前,納米科技、微電子加工、先進製造業、 生物醫學等領域均需要大行程(指毫米級)納 米級定位^[1,2],用於大面積樣品測量的原子力顯 微鏡和半導體工業中的光刻機也需要對工作臺 在毫米行程上實現納米或亞納米精度的定位控 制。因此,開發毫米行程納米或亞納米精度的 定位系統已成為相關領域各國科學家競相研究 的熱點。

壓電陶瓷是新型的微位移器件,具有結構 簡單、體積小、分辨力高、控制簡單、沒有發 熱問題等優點,是理想的微位移器件^[3]。使用壓 電陶瓷元件實現大行程的途徑是構成超聲波馬 達,壓電陶瓷元件組在共振信號作用下,形成 彎曲和伸縮兩種變形模式,兩種運動合成為橢 圓形運動軌跡,通過摩擦力驅動平臺,其解析 度小於1nm,行程由陶瓷片長度和滑軌長度決 定。

DSP晶片因其運算速度快、即時性強、功耗 低、抗干擾能力強等特點,愈來愈多地被應用 在控制和檢測領域,是理想的微控制器。

因此,以DSP作為主控制器,壓電陶瓷作為 微位移器件設計了一套高精度一維納米定位控 制系統。

2. 系統總體結構及原理

一維納米定位控制系統結構圖如圖1所示。

第11 屆 海峽兩岸計量學術研討會 2016 兩岸量測與檢測科技學術研討會 2016 年 11 月 1 日~3 日 臺灣·

AB2 Linear Stage& Motor Driv HR4&Michel Analog Command LCD& Power DAC3 Switche <u>ן</u> ADC1& ADC2 CPLD DSP Process EMIF RTL8019AS Ethernet PC Board Ŷ Counter DAC1& DAC2 EEPRON I/O **DSP Process Board**

圖1 系統結構框圖

PC軟體通過乙太網向DSP處理板下達位移 指令,微型納米位移感測器---偏振邁克爾遜鐳 射干涉儀(後邊簡稱Michelson干涉儀)感測滑 執實際移動的位移,DSP將目標位移與滑軌實際 移動位移進行比較,在BP神經網路模型的説明 下計算出最佳PID控制參數,進而由PID控制演 算法計算出控制量,由DAC3輸出相應的類比電 壓,AB2驅動控制器將類比電壓轉換成對應驅動 超聲波馬達HR4的波形,從而保證線性滑軌平穩 準確的運行。

3. 系統硬體設計

3.1 驅動平臺設計

驅動平臺由三個部分組成:線性滑軌、陶瓷 片、超聲波馬達HR4、驅動器AB2。圖2為線性 滑軌與HR4的安裝模型圖。



3.1.1 線性滑軌的選擇

線性滑軌的直線度直接影響定位系統運動 過程的平緩性和定位精度。本系統選擇米思米 公司生產型號為CRU3080交叉滾子型滑軌,該 滑軌往復行程45 mm,滑軌中央部平行度平行度 為2 um,側面平行度5 um。 臺灣·中壢 中原大學

3.1.2 位移驅動器件的選擇

高解析度的驅動方式是實現精確定位的前 提。Nanomotion公司利用壓電效應設計並製造 了超聲波電機HR4。Nanomotion公司在HR4單個 接觸端子上放置四個壓電陶瓷片元件,利用四 組電極放置於壓電陶瓷片的表面可以產生伸縮 和彎曲兩種狀態,這兩種狀態經過合成後可以 形成圓形或者橢圓形運動軌跡。HR4的示意結構 及運動模態圖如下圖所示:



圖3HR4結構及其工作模態圖

當兩組電極A、A'和B、B'一組伸長一組縮 短並加以不同方向驅動時產生彎曲模態的運 動,而如果兩組同時伸長或縮短時則產生伸縮 運動。如果固定其中一組對另一組加以弦波驅 動時,則會往某一方向運動。HR4堆疊了四個接 觸端子,可以有效的提高驅動力,增加穩定度。 Nanomotion公司根據壓電陶瓷元件工作模態的 不同組合,開發出多種電機驅動模式。

3.1.3 HR4的驅動器選擇

HR4正常工作需要配有專門的驅動器。本系 統選用Nanomotion公司生產的驅動器AB2,它提 供了三種驅動模式,用以滿足超聲波馬達不同 行程的需求,AC模式,用於長行程毫米級驅動; GATE模式,用於中行程微米級驅動;DC模式, 用於短行程納米級定位驅動。超聲波電機HR4 與驅動器AB2的配合可以組成三種不同的驅動 模式,實現大行程高解析度的驅動控制^[4,5],這 是高精度定位系統實現納米級定位的硬體基 礎。

3.2 位移感測單元設計

只有即時準確感測出滑軌的位移值,將此位 移與目標位移進行相關運算才能得出AB2準確 的輸出量。本系統位移感測單元選用作者所在 團隊自發研製的微型邁克爾遜干涉儀。

3.2.1 邁克爾遜干涉儀結構及其原理

該邁克爾遜干涉儀由鐳射二極體、偏振分光 棱鏡、非偏振分光棱鏡、四分之一波片、固定 第11屆海峽兩岸計量學術研討會2016兩岸量測與檢測科技學術研討會 2016年11月1日~3日 臺灣

不動的平面參考鏡、固定在運動物體上的測量 鏡以及感測干涉信號的光電池構成,其結構圖 如圖4所示^[6]。



LD: Laser Diode RM: Reference Mirror MM: Metrology Mirror PBS: Polarized Beam Splitter NPBS: Non-Polarized Beam Splitter Q: Quarter Waveplate PD: PhotoDetector

圖4 Michelson鐳射干涉儀結構圖

雷射器LD發出的偏振光,經過偏振分光棱 鏡PBS1和四分之一波片Q1、Q2,分別變成旋向 相反的兩束圓偏振光,一束打在測量鏡MM上返 回,一束打在參考鏡RM上返回,返回的兩束光 再次經過以上Q1、Q2和PBS1,又變成線偏振光 (0光和e光),再經過四分之一波片Q3變成旋向 相反的兩束圓偏振光,兩束光重合並發生干 涉;最後再經過非偏振分光棱鏡NPBS2及後面 的偏振分光棱鏡PBS2、PBS3組成的鑒相模組, 提取出相位分别是0度,90度,180度,270度的 干涉信號,四個光電池PD1-PD4分別感測干涉條 紋的光強變化。因此,測量鏡位移變化可通過 對干涉條紋明暗變化規律進行計數和細分,便 可以同步轉換出運動的位移量。將測量鏡固定 於線性滑軌的一端,則滑軌移動的位移即可通 過測量鏡移動的位移間接得出。

3.2.2 邁克爾遜干涉儀信號處理電路

理論上PD1-PD4輸出的為四路兩兩正交的 弦波電流信號,但實際使用中,信號存在三種 典型的失真^[7],分別是背景光強變化和光電探測 器差異性造成的直流漂移,機台處於不同位置 時造成的幅值變化和安裝誤差導致的兩路信號 不完全相差90度,為消除誤差需要將信號進行 硬體處理,處理過程如圖5所示。經信號處理板 最終輸出的兩路信號為一組完全正交的弦波信 號,對正交弦波信號進行計數和細分,便可得 出運動物體的位移量。



3.3 主控制器 DSP 單元設計

DSP 處理板內部結構緊湊複雜,集結了 DAC、ADC、電壓比較器 AD790、雙向可逆正 交脈衝計數器 HCTL2022、RTL8019AS、CPLD、 DSP 等器件。PC 機通乙太網控制器 RTL8019AS 實現通信,來獲取使用者指令。正交弦波信號 進入 DSP 處理板後,同時送至 ADC1/ADC2 和 比較器。ADC1/ADC2 將弦波信號轉換成數位 量,通過 CPLD 的介面轉換傳輸到 DSP 中。DSP 計算出兩路弦波信號的直流偏量,再經 CPLD 寫給 DAC1/DAC2,轉換成類比電壓信號作為電 壓比較器的參考電壓,此參考電壓可以有效消 除信號中的直流偏量。比較器再將當前的弦波 信號轉換成正交脈衝信號,輸入到雙向可逆正 交脈衝計數器中,計數大數位移。而對 ADC1/ADC2 轉換的數位量進行相關運算,可以 進行相位細分。將大數計數和相位細分結合起 來,就可以得到當前精確位移。由當前位移和 歷史位移以及目標位移可以計算出對 AB2 的控 制量,通過操作 CPLD 上控制 AB2 的介面,即 可完成運動控制。

4. 系統軟體設計

4.1 位移感測軟體設計

位移測量軟體流程圖如圖 6 所示



圖 6 位移測量軟體流程圖

第11 屆 海峽兩岸計量學術研討會 2016 兩岸量測與檢測科技學術研討會 2016 年 11 月 1 日~3 日 臺灣·

系統初始化之後,採集一次資料計算初始相 位,在單次運動過程中,只會計算一次初相位。 接下來會每3ms檢查一次計數器HCTL2022的 讀數,是否與上次讀數一致,如果讀數一致, 表示機台處於停止狀態,則置位元標誌位元, 同時每2ms對各通道採樣50次,如果採樣時 間達到60ms後,更新振幅和直流偏量。接下 來讀取HCTL2022的完整計數值,通過判斷上 述機台靜止標誌位元決定是否進行末相位的採 集與計算,然後整合總位移值,並通過LCD液 晶屛顯示。

4.2 運動控制軟體設計

系統運動控制流程圖如圖7所示。

為使定位系統達到快速、穩定和準確的定位 效果,將滑軌的一次定位分為三個階段:開始 使用 AC 模式驅動平臺以 0.5 mm/s 的速度快速 逼近目標點 3 um 處, BP 神經網路的輸入為期 望速度減去真實速度的誤差;接著用 Gate 模式 以 20-50 nm 的步距逼近目標點 50 nm,此時 BP 神經網路的的輸入為目標步距減去當前步距的 差值;最後使用 DC 模式鎖位元,此時 BP 神經 網路的的輸入為目標位置減去當前位置的差 值。



圖7 運動控制軟體流程圖

4.3 基於 BP 神經網路的 PID 控制演算法

PID 控制演算法是工程中最為常用的控制演算法,具有結構簡單、易於理解等優點,但應用時需要事先整定好合適的參數,整定過程比較困難,且參數為固定值。對於納米定位系統, 需要保證滑軌在高速運動下的穩定性和低速運

臺灣·中壢 中原大學

動下的精確性,但滑軌不可避免存在直線度誤 差且與超聲波電機接觸的各處摩擦力係數不 同,所以系統數學模型是複雜多變的,為了保 證滑軌運行的穩定性與準確性,就要求 PID 控 制參數可以即時調整。因此,本系統選擇基於 BP 神經網路的 PID 控制演算法。

系統所用倒傳遞 BP 神經網路如圖 8 所示, 它由輸入層、隱藏層和輸出層組成,輸入層由 err(k)-err(k-1)、 err(k)、 err(k)-2err(k-1)+err(k-2) 三個神經元組成,輸出層作為 PID 控制演算法 中 Kp、Ki 和 Kd 三個參數的值。通過 BP 神經 網路演算法可以即時自動調整 PID 演算法中的 三個參數的值,具體演算法參考文獻^[8,9,10]



圖 8 BP 神經網路結構圖

5. 實驗結果

對該一維定位系統進行 5 組不同的實驗測 試,平臺移動位移設定值分別為:1 mm、6 mm、 10 mm、15 mm、20 mm,每組實驗重複進行 10 次。實驗結果如表 1 所示,平臺實際移動位移 由 HP5529A 鐳射干涉儀讀取,在全量程內平臺 定位精度優於 10 nm,重複定位標準差為 7 nm。

表1 實驗測試結果

		• • •	-		
次数	位移/mm				
	1	6	10	15	20
1	0.999997	5.999998	9.999990	15.000005	20.000005
2	0.9999999	5.999998	9.999990	15.000003	19.999996
3	0.999996	5.999995	9.999996	14.999993	19.999996
4	1.000006	5.999996	9.999993	14.999996	20.000007
5	1.000003	5.999998	9.999994	15.000001	19.999992
6	0.999996	6.000007	10.000002	15.000005	20.000007
7	1.000001	5.999995	9.999995	14.999997	20.000008
8	0.999998	6.000003	9.999996	14.999998	20.000001
9	0.9999999	6.000001	10.000001	14.999998	19.999992
10	0.999997	5.999996	10.000003	14.999996	19.999998
平均					
值/mm	0.999992	5.999991	9.999996	14.99999	20.000002
标准					
差/mm	3	4	5	5	7
最 大 识美	6	7	10	5	Q
/mm	0	/	10	5	8

第11 屆 海峽兩岸計量學術研討會 2016 兩岸量測與檢測科技學術研討會 2016 年 11 月 1 日~3 日 臺灣・中壢

6. 結論

設計了一套以微處理器 DSP 為主控制器的 一維納米定位控制系統,該納米定位系統行程 為 20mm,實驗結果表明:在全量程內平臺定 位精度優於 10 nm,重複定位標準差為 7 nm。 該系統具有定位精度高、重複性好、集成度高、 功耗低等優點,對於當前納米科技、半導體領 域、微納機械加工等均有較大的實用價值。

7. 致謝

國家自然科學基金專案支助(51475131)。

8. 參考文獻

- 夏瑞雪,陳曉懷,盧榮勝等。"新型納米三 座標測量機誤差檢定方法的研究",電子測 量與儀器學報. J.,vol. 24,2010,pp250-256.
- [2] HAITJEM A H, "Achieving traceability and sub-nanometer uncertainty using interferometric techniques", *Measurement Science and Technology*, J., vol. 19,2008,pp1-6.
- [3] B. 實菲著,林聲和譯.壓電陶瓷[M].北京, 科學出版社, 1979.
- [4] Steinmetz C. R.. Sub-micron position measurement and control on precision machine tools with laser interferometer[J]. Prec. Eng., 1990, 12(1): 12–24.
- [5] Nanomotion Ltd. HR4 Ultrasonic Motor User Manual. P/N MSP4-M00-M00-30. www.nanomotion.net.
- [6] 張友良. 納米三座標測量機共平面二維平 臺的改進及關鍵傳感技術的研究[D]. 合肥 工業大學碩士論文, 2013.
- [7] Heydemann P. L. M.. Determination and Correction of Quadrature Fringe Measurement Errors in Interferometers.J., Applied Opt vol. 20 (19),1981, pp 3382-3384.
- [8] Sirisena H, Teng F. "Multivariable pole-zero placement selftuning controller", International Journal of Systems Science. J., vol. 17, 1986, pp 345-352.
- [9] Wang J, Kang L Y, Cao B G. "Neural network PID control of a distributed power generation system based on renewable energy", Journal of

Applied Sciences. J.,vol. 5(10),2005, pp 1772-1776.

[10] 程方.納米三座標測量機測控系統關鍵技術研究[D].合肥工業大學博士論文,2010.

中原大學